

Misura della caratteristica di due diodi a giunzione p-n

Bertasi Leonardo, Perniola Davide

Quarto turno

1 Introduzione

Lo scopo della prova è stato quello di misurare la caratteristica I-V di due diodi a semiconduttore, in particolare uno al silicio e uno al germanio...qualcosa id più sugli obb L'apparato sperimentale era composto un alimentatore di bassa tensione, un multimetro digitale, un oscilloscopio, un potenziometro da $1k\Omega$ oltre che dai due diodi in esame. Il circuito realizzato è riporato in Figura 1.

2 Risultati

3 Conclusioni